

ترکیب روش‌های سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر (Euler Deconvolution) برای تفسیر داده‌های مغناطیسی دوبعدی (AN_EUL)

جمال الدین بنی‌عامریان^{۱*} و بهروز اسکویی^۲

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد زئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، مؤسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

^۲استادیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

(دریافت: ۸۷/۱۲/۱۰، پذیرش نهایی: ۸۹/۱۱/۱۹)

چکیده

روش AN-EUL روش خودکار برای برآورد مکان و محاسبه عمق و اندیس ساختاری (Structural index) (شکل) چشممه‌های مغناطیسی است. این روش ترکیبی از دو روش سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر است و معادلات آن از جایگذاری مشتق‌های مناسب معادله اویلر در معادله سیگنال تحلیلی میدان به دست می‌آید. در این مقاله روش AN-EUL برای برآورد مکان و محاسبه عمق و اندیس ساختاری ساختارهای دو بعدی به کار گرفته شده است. به‌این‌ترتیب که، ابتدا با استفاده از مدل سازی به روش پیشرو (Forward modeling) برای برخی مدل‌های دو بعدی مغناطیسی ساده مانند، دایک نازک، دایک ضخیم و استوانه افقی، که همه پارامترهای آنها معین است داده مصنوعی تولید شده است. سپس در مرحله بعد همه کمیت‌های موردنیاز در روش AN-EUL برای این داده‌های تولید شده محاسبه شده و درنهایت با استفاده از روابط کلی روش AN-EUL مقادیر عمق و اندیس ساختاری برای هر کدام از این مدل‌ها به دست آمده و با مقادیر واقعی شان مقایسه شده است. درصد خطأ و تفاوت مقادیر محاسبه شده با مقادیر واقعی پارامترها نشان می‌دهد که این روش دقت قابل ملاحظه‌ای در تعیین عمق و اندیس ساختاری چشممه‌های مغناطیسی دارد. همه مراحل محاسباتی در این مقاله، اعم از تولید داده مصنوعی، فیلترهای لازم و روابط اصلی تعیین عمق و اندیس ساختاری با استفاده از برنامه‌های d که در محیط مطلب نوشته شده، صورت گرفته است.

واژه‌های کلیدی: سیگنال تحلیلی، واهمامیخت اویلر، اندیس ساختاری، مشتق‌های افقی و قائم میدان

Combination of analytic signal and Euler Deconvolution methods for interpretation of 2-D magnetic data

Baniamerian, J.¹ and Oskooi, B.²

¹ M. Sc. Student of Geophysics, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran

² Assistant Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran

(Received: 28 Feb 2009, Accepted: 8 Feb 2011)

Abstract

AN_EUL is a new automatic method for simultaneous approximation of location, depth, and structural index (geometry) of magnetic sources. In the 2D case analytic signal is defined as a conjugate function whose imaginary part is the Hilbert transform of its real part. Since the first vertical derivative of the magnetic field is the Hilbert transform of its horizontal derivative, vertical and horizontal derivatives of the magnetic field can produce an analytic signal function whose amplitude is equal to the root of the summation of square of the horizontal and vertical derivatives. Analytic signal has some useful properties. For 2D sources the amplitude shape of the analytic signal is an even and symmetric function whose maximum determines the location of the source. Moreover, the

shape of the amplitude does not depend on the orientation of magnetization, strike, inclination and declination of the magnetic field.

The Euler Deconvolution method is an automatic procedure to approximate the geometry, depth and location of the magnetic sources. In this method there is no need for reduction to the pole and remnant magnetization is not an interfering factor. The principle of the Euler Deconvolution method is based on the Euler Homogeneous differential equation.

The AN_EUL method is a combination of analytic signal and Euler Deconvolution methods, and its main equations are derived by substituting appropriate derivatives of the Euler homogeneous equation into the expression of analytic signal of the potential field. AN_EUL equations are calculated at the source location that is approximated by the location of the maximum of analytic signal amplitude. In this paper, the AN_EUL method has been used for the determination of location, depth and structural index of 2D magnetic structures. At the first step, by using the forward modeling for some ideal 2D magnetic models, such as thin dike, thick dike and horizontal cylinder with given parameters, the synthetic data has been produced. At the next step, all of the required quantities in the AN-EUL method have been calculated for these series of data. In the final step, the depth and structural index of these models are calculated using the general formulas of AN-EUL and are compared with their real values. The levels of error and difference between the calculated values and real values of depth and structural index show that this method has an acceptable accuracy in approximating the structural index and depth of sources. Because AN_EUL equations use high order magnetic derivatives, the noises are amplified intensely; consequently for better resolution an upward continuation filter should be used. For some models like thick dikes, the analytic signal amplitude may have two maximums. For solving this problem the data should be continued to a higher level by upward continuation filter. In addition, since the derivatives are calculated by Fourier transform, it is necessary to taper the data before using this transform to avoid Gibbs effect. All of the computational steps in this paper, such as creation of synthetic data, necessary filters and the main equations of AN-EUL have been done by codes written in MATLAB.

Key words: Analytic signal, Euler Deconvolution, Structural index, Horizontal and vertical derivatives of field

۱ مقدمه

سیگنال تحلیلی ارتفا یافته (Enhanced analytic signal) برای تعیین عمق ساختارهای زمین‌شناسی مانند دایک و گسل استفاده کرد. بر همین اساس، باستانی و پدرسون (۲۰۰۱) از سیگنال تحلیلی برای محاسبه پارامترهای دایک (عمق، پهنا، مغناطیس شوندگی، زاویه شب، امتداد) استفاده کرد. یکی از دلایل به کار گیری سیگنال تحلیلی در تفسیر داده‌های مغناطیسی وابسته نبودن آن به کمیت‌های جهتی و امکان تعیین موقعیت چشمی با استفاده از محل مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی است.

تاکنون برای برآورد پارامترهای چشمی‌های مغناطیسی (عمق، مکان، مرز چشمی و شکل) براساس استفاده از مشتق‌های میدان روش‌های گوناگونی ابداع شده است. یکی از این روش‌ها روش سیگنال تحلیلی است که ابتدا نیکیان (۱۹۷۲) آن را در برآورد عمق سطح تماس (Contact) به کار برد. آتچیوتو و همکاران (۱۹۸۱) با استفاده از مجموعه‌ای از نقاط مشخص روی منحنی دامنه سیگنال تحلیلی، روابطی را برای محاسبه عمق تا سطح دایک به دست آورد. هسیو و همکاران (۱۹۹۶) از مفهوم

روابط زیر تعریف می‌شوند:

$$A(x, y) = \frac{\partial T}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{j} + i \frac{\partial T}{\partial z} \hat{k} \quad (3)$$

$$|A(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial z}\right)^2} \quad (4)$$

سیگنال تحلیلی در تعیین محل و عمق چشم‌های مغناطیسی کاربرد دارد. برای چشم‌های دو بعدی (دایک)، استوانه افقی، سطح تماس) دامنه سیگنال تحلیلی همواره یکتابع زوج و متقارن است و دامنه آن بسته به نوع مدل، روی جسم یا روی لبه‌های آن به مقدار پیشینه خود می‌رسد. با استفاده از این ویژگی سیگنال تحلیلی می‌توان محل یا مرزهای چشم را مشخص کرد. برای چشم‌های دو بعدی، شکل منحنی دامنه سیگنال تحلیلی مستقل از کمیت‌های جهتی مانند جهت مغناطیدگی، زاویه شب، زاویه میل و انحراف میدان و امتداد خفت (strike) است. بنابراین مغناطیس باقیمانده عامل مزاحمی نخواهد بود و این کمیت‌های جهتی فقط روی اندازه دامنه سیگنال تحلیلی تاثیر دارند. تاثیر نداشتن کمیت‌های جهتی بر شکل منحنی دامنه سیگنال تحلیلی، ویژگی بسیار جالب سیگنال تحلیلی در حالت دو بعدی است. این اثر، به خصوص در مناطقی که مغناطیس باقیمانده معلوم نیست، بسیار مهم است.

سیگنال تحلیلی ارتقا یافته مرتبه n عبارت است از سیگنال تحلیلی مشتق قائم مرتبه n ام میدان (هسیو، ۱۹۹۶).

$$A_n(x, y) = \frac{\partial T_n^z}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial T_n^z}{\partial y} \hat{j} + i \frac{\partial T_n^z}{\partial z} \hat{k} \quad (5)$$

$$|A_n(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial T_n^z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial T_n^z}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial T_n^z}{\partial z}\right)^2} \quad (6)$$

در این روابط، $T_n^z = \frac{\partial^n T}{\partial z^n}$ ، مشتق قائم مرتبه n ام میدان است. هسیو از مفهوم سیگنال تحلیلی ارتقاء یافته برای تعیین عمق ساختارهای دو بعدی (خطی) مثل دایک و سطح تماس استفاده کرد. در حالت دو بعدی مشتق در جهت y صفر است.

روش واهمامیخت اویلر نیز یکی از روش‌های خودکار برای تفسیر داده‌های مغناطیسی است که اساس آن استفاده از مشتق‌های میدان در معادله همگن اویلر است. تامپسون (۱۹۸۲) از این روش برای برآورد عمق و شکل ساختارهای دو بعدی استفاده کرد. رید و همکاران (۱۹۹۰) روش واهمامیخت اویلر را برای حالت سه بعدی تعیین داد.

سالم و راوات (۲۰۰۳) با ترکیب این دو روش، روش خودکار جدیدی تحت عنوان AN-EUL ابداع کرد. این روش بسیاری از محدودیت‌های روش‌های پیشین را ندارد و با استفاده آن می‌توان عمق، مکان و اندیس ساختاری چشم‌های مغناطیسی را به طور همزمان تعیین کرد. از ویژگی‌های مهم این روش محدود نبودن آن به مدل‌های ایدئال (مدل‌های دارای اندیس ساختاری عدد صحیح) است. همچنین، اندیس ساختاری می‌تواند عددی کسری باشد که توصیف کننده اجسام با شکل دلخواه است.

۲ نظریه روش

اساس این روش جایگذاری مشتق‌های معادله اویلر در معادله سیگنال تحلیلی است. در اینجا هر کدام از این روش‌ها به طور مختصر توضیح داده می‌شوند.

۱-۲ روش سیگنال تحلیلی

سیگنال تحلیلی در حالت دو بعدی یک تابع موهومنی است که قسمت موهومنی آن تبدیل هیلبرت قسمت حقیقی آن است. مشتق قائم میدان مغناطیسی برابر است با تبدیل هیلبرت مشتق افقی آن، بنابراین تابع سیگنال تحلیلی و دامنه سیگنال تحلیلی میدان اندازه گیری شده در حالت دو بعدی با روابط زیر تعریف می‌شوند (نبیقیان، ۱۹۸۴):

$$A(x) = \frac{\partial T}{\partial x} + i \frac{\partial T}{\partial z} \quad (1)$$

$$|A(x)| = \sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial z}\right)^2} \quad (2)$$

در حالت سه بعدی سیگنال تحلیلی میدان و دامنه آن با

n - است و در معادله اویلر صدق می کند:

$$(x-x_0) \frac{\partial \Delta T}{\partial x} + (y-y_0) \frac{\partial \Delta T}{\partial y} + (z-z_0) \frac{\partial \Delta T}{\partial z} = -n \Delta T \quad (11)$$

در رابطه (11) نقطه (x_0, y_0, z_0) محل چشم، نقطه (x, y, z) نقطه اندازه گیری و تابع همگن ΔT بی هنجاری میدان است. ضریب n اندیس ساختاری و نشان دهنده نرخ تغییرات میدان با فاصله از چشم است. با معلوم بودن n می توان شکل کلی چشم را برآورد کرد. جدول ۱ اندیس ساختاری را برای برخی مدل های ساده نشان می دهد.

در حالت کلی میدان اندازه گیری شده کل در هر نقطه (x, y, z) را می توان مجموع میدان ناشی از چشم، \bar{T} ، ΔT ، و میدان زمینه \bar{B} دانست که \bar{B} مقدار ثابتی دارد:

$$\vec{T} = \Delta \vec{T} + \vec{B} \quad (12)$$

با جایگذاری رابطه (12) در معادله (11) داریم:

$$x_0 \frac{\partial T}{\partial x} + y_0 \frac{\partial T}{\partial y} + z_0 \frac{\partial T}{\partial z} + nB = x \frac{\partial T}{\partial x} + y \frac{\partial T}{\partial y} + z \frac{\partial T}{\partial z} + nT \quad (13)$$

این معادله باید برای تمام نقاط شبکه یا نیم رخ حل شود. پارامتر های x_0, y_0, z_0, B مجهول های این معادلات هستند. چون تعداد معادلات از تعداد مجهول ها بیشتر است برای حل معادلات باید از روش کمترین مربعات استفاده کرد.

جدول ۱. رابطه بین اندیس ساختاری، نوع مدل و موقعیت عمق محاسبه شده (هسیو و همکاران، ۱۹۹۸).

نقطه ای از ساختار که عمق آن تعیین می شود	نوع ساختار مغناطیسی	اندیس ساختاری n
عمق تا سطح گسل، لبه سطح تماس	گسل و سطح تماس که نسبت عمق به ضخامت آن کوچک است	۰
عمق تا سطح، عمق تا نقطه ای داخل سطح تماس	دایک نازک و سطح تماس که نسبت عمق به ضخامت آن بزرگ است	۱
عمق تا مرکز	استوانه افقی، استوانه عمودی	۲
عمق تا مرکز	کره مغناطیسی یا دو قطبی مغناطیسی	۳

۲-۲ روش واهمامیخت اویلر

روش واهمامیخت اویلر روشی خودکار برای برآوردن عمق، شکل و مکان چشممه های مغناطیسی است. در روش اویلر نیازی به انتقال به قطب نیست و مغناطیس باقیمانده عامل مزاحمی نخواهد بود (راوات، ۱۹۹۶). اساس این روش استفاده از معادله دیفرانسیل همگن اویلر است. روش اویلر را می توان روی داده های نیم رخ (دو بعدی) و همچنین داده های شبکه ای (سه بعدی) اعمال کرد.

تابع $f(x, y, z)$ همگن از مرتبه n می گویند در صورتی که رابطه زیر برای هر ضریب دلخواه و حقیقی t برقرار باشد. (بلیکلی، ۱۹۹۵):

$$f(tx, ty, tz) = t^n f(x, y, z) \quad (7)$$

در این صورت تابع f در معادله دیفرانسیل زیر صدق می کند:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = n f(x, y, z) \quad (8)$$

معادله دیفرانسیل (8) معادله دیفرانسیل همگن اویلر نام دارد. از طرفی میدان مغناطیسی ناشی از بسیاری از چشممه های ساده مغناطیسی به شکل زیر است:

$$\Delta T(x, y, z) = \frac{a}{r^n} \quad (9)$$

در این رابطه a یک مقدار ثابت و r فاصله چشم از نقطه اندازه گیری است:

$$r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (10)$$

با توجه به روابط (7) و (9)، ΔT تابع همگن از مرتبه

$$z_0 |AAS_1|_{x=x_0, y=y_0} = (n+1) |AAS_0|_{x=x_0, y=y_0} \quad (18)$$

در این رابطه $|AAS_1|$ و $|AAS_0|$ به ترتیب دامنه سیگنال تحلیلی بی‌هنگاری مغناطیسی و دامنه سیگنال تحلیلی مشتق قائم مرتبه اول بی‌هنگاری مغناطیسی (دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه اول) هستند. یادآوری می‌شود که نقطه (x_0, y_0) نشان‌دهنده موقعیت افقی چشمی است. بنابراین با توجه به رابطه (۱۸) دامنه سیگنال‌های تحلیلی بی‌هنگاری مغناطیسی باید در مختصات افقی چشمی محاسبه شود.

برای بدست آوردن روابط مستقل، به منظور محاسبه عمق و اندازه ساختاری ابتدا از معادله (۱۳) نسبت به z مشتق گرفته می‌شود:

$$\begin{aligned} x \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial z} + y \frac{\partial^2 T}{\partial y \partial z} + \frac{\partial T}{\partial z} + z \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + n \frac{\partial T}{\partial z} = \\ x_0 \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial z} + y_0 \frac{\partial^2 T}{\partial y \partial z} + z_0 \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \end{aligned} \quad (19)$$

اگر از طرفین این معادله نسبت به x, y, z مشتق بگیریم و قرار دهیم $x = x_0, y = y_0, z = 0$ روابط زیر به دست می‌آید:

$$(n+2) \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x \partial z} \right)_{x=x_0, y=y_0} = z_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (20)$$

$$(n+2) \left(\frac{\partial^2 T}{\partial y \partial z} \right)_{x=x_0, y=y_0} = z_0 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (21)$$

$$(n+2) \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} = z_0 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (22)$$

طرفین سه معادله بالا را به توان دو می‌رسانیم، سپس از دو طرف معادله به دست آمده جذر گرفته می‌شود و درنهایت با استفاده از رابطه (۶) رابطه زیر به دست می‌آید:

$$(n+2) |AAS_1|_{x=x_0, y=y_0} = z_0 |AAS_2|_{x=x_0, y=y_0} \quad (23)$$

$|AAS_2|$ دامنه سیگنال تحلیلی مشتق قائم مرتبه دوم بی‌هنگاری مغناطیسی (دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه دوم) است. با جایگذاری معادله (۲۳) در معادله (۱۸) روابط

۳-۲ روش AN_EUL

روش AN_EUL یک روش خودکار برای تفسیر داده‌های مغناطیسی است. با استفاده از این روش می‌توان عمق، مکان و شکل چشمی را به طور همزمان برآورد کرد. این روش برای تفسیر داده‌های نیم‌رخی (دوبعدی) و شبکه‌ای (سه‌بعدی) به کاربرده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این روش محدود نبودن آن به مدل‌های ایدئال (مدل‌های دارای اندیس ساختاری عدد صحیح) است و اندیس ساختاری می‌تواند یک عدد کسری باشد که توصیف کننده اجسام با شکل دلخواه است. اساس این روش جایگذاری مشتق‌های معادله اویلر در معادله سیگنال تحلیلی است. بنابراین برای بدست آوردن معادلات اصلی روش AN_EUL از معادله (۱۳) در جهت‌های متفاوت در نقطه (x_0, y_0) واقع در صفحه $z=0$ یعنی در نقطه $(x_0, y_0, 0)$ که دقیقاً در بالای جسم قرار دارد (مکان افقی چشمی) مشتق گرفته می‌شود.

$$z_0 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x \partial z} \right)_{x=x_0, y=y_0} = (n+1) \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (14)$$

$$z_0 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial y \partial z} \right)_{x=x_0, y=y_0} = (n+1) \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (15)$$

$$z_0 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} = (n+1) \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right)_{x=x_0, y=y_0} \quad (16)$$

طرفین سه معادله بالا به توان دو می‌رسند و با هم جمع می‌شوند. سپس از دو طرف معادله به دست آمده جذر گرفته می‌شود.

$$\begin{aligned} z_0 \left(\sqrt{\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x \partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z \partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} = \\ (n+1) \left(\sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right)^2} \right)_{x=x_0, y=y_0} \end{aligned} \quad (17)$$

با استفاده از رابطه (۶) می‌توان رابطه بالا را به طور خلاصه نوشت:

که این روش بر روی داده‌های مصنوعی اعمال شود. با استفاده از مدل‌سازی به روش پیشرو، برای مدل‌های مغناطیسی استوانه افقی بی‌نهایت، دایک نازک و دایک ضخیم داده مصنوعی تولید می‌شود. سپس روش فوق بر روی این داده‌ها اعمال و جواب‌های به‌دست آمده با مقادیر واقعی آنها (پارامترهای مدل‌ها) مقایسه می‌شود. برای برآورد واقعی تر داده‌های مصنوعی، به داده‌های مصنوعی تولید شده نوافه اضافه شده است.

مدل استوانه افقی بی‌نهایت و دایک نازک: یک استوانه افقی و یک دایک نازک با مشخصات ذکر شده در جدول ۲ در نظر می‌گیریم و روش AN_EUL را بر روی داده‌های مصنوعی ناشی از این مدل‌ها اعمال می‌کنیم. محور استوانه و راستای دایک عمود بر راستای نیم‌رخ اندازه‌گیری فرض شده است.

پس از ادامه فراسوی داده‌ها و اعمال روش AN_EUL، جواب‌های مورد نظر مطابق جدول ۳ به‌دست می‌آید. با توجه به نتایج این جدول مقادیر به‌دست آمده برای اندیس ساختاری دایک و استوانه ۱/۰۵ و ۱/۹۵ است که در مقایسه با مقادیر واقعی آنها در جدول ۱ دارای دقت خوبی هستند و شکل ساختار به‌خوبی برآورد می‌شود. همچنین برآورد عمق با خطای ۲/۵ و ۴ درصد برای دایک و استوانه قابل قبول است. لازم به ذکر است که درصد خطای برآورد عمق برای عمق چشمۀ نسبت به سطح ادامه فراسو سنجیده می‌شود. در هر دو حالت مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی در نقطه ۱۰۰ کیلومتری از ابتدای نیم‌رخ، یعنی دقیقاً بر روی ساختارها قرار گرفته است. بنابراین با توجه به این نتایج، می‌توان گفت که روش AN_EUL دقت و کارایی قابل قبولی برای برآورد عمق و اندیس ساختاری و محل چشمۀ دارد.

کلی برای برآورد اندیس ساختاری (شکل چشمۀ) و عمق به‌دست می‌آید:

$$n = \left(\frac{2|AAS_1|^2 - |AAS_2||AAS_0|}{|AAS_2||AAS_0| - |AAS_1|^2} \right)_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \quad (24)$$

$$z_0 = \left(\frac{|AAS_1||AAS_0|}{|AAS_2||AAS_0| - |AAS_1|^2} \right)_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \quad (25)$$

کلیه مشتق‌های میدان با استفاده از فن FFT محاسبه می‌شود. هیچ کدام از معادلات بالا وابستگی صریح به مغناطیس شوندگی ندارند، لذا مغناطیس باقی‌مانده عامل مزاحمی نخواهد بود و نیازی به محاسبه آن نیست. در مورد ساختارهای خطی (دوبعدی) مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی دقیقاً روی چشمۀ قرار می‌گیرد. بنابراین با استفاده از این ویژگی می‌توان محل چشمۀ یعنی نقطه x_0 را تعیین، سپس با استفاده روابط (۲۴) و (۲۵) اندیس ساختاری و عمق را محاسبه کرد. همانند سایر روش‌هایی که از مشتق‌های میدان استفاده می‌کنند، دقت این روش تا حد بسیار زیادی به کیفیت داده‌های اندازه‌گیری شده و نوافه‌ها بستگی دارد. برای کاهش اثر نوافه‌ها و بی‌هنجری‌های سطحی، از ادامه فراسوی داده‌ها به یک سطح بالاتر استفاده می‌شود. با توجه به اینکه برای محاسبه کلیه مشتق‌های میدان از روش FFT استفاده می‌شود، بنابراین قبل از اعمال روش، به منظور جلوگیری از اثر گیبس (پدیده رینگی شدن ابتدا و انتهای یک سیگنال به دلیل قطع ناگهانی، هنگامِ اعمال تبدیل فوریه) حتماً لازم است که داده‌ها تیپر (بسط خطی سیگنال قبل از اعمال تبدیل فوریه، به منظور کاهش اثر گیبس (Taper)) شوند.

۳ اعمال روش بر روی داده‌های مصنوعی
برای ارزیابی میزان دقت و کارآیی روش AN_EUL و همچنین اطمینان از درستی برنامه نوشته شده لازم است

جدول ۲. مشخصات مدل‌های استوانه افقی و دایک نازک برای تولید داده مصنوعی.

استوانه افقی	دایک نازک	پارامترهای مدل
۱۰	۸	عمق (کیلومتر)، Z_0
۱۰۰	۱۰۰	موقعیت افقی نسبت به مبدأ (کیلومتر)، X_0
القایی و باقی‌مانده	۱۰	مغناطیس شوندگی
۱۵	—	گشتاور مغناطیسی در واحد طول (استوانه)
۵۰	۴۵	زاویه میل میدان زمین
۲۰	۰	زاویه انحراف میدان زمین
۳۰	۴۵	زاویه میل مغناطیس شوندگی کل
۱۰	۰	زاویه انحراف مغناطیس شوندگی کل
—	۹۰ درجه	زاویه شبیه (دایک)
۱	۱	فاصله بین نقاط اندازه‌گیری (کیلومتر)
۲۰۰	۲۰۰	تعداد نقاط اندازه‌گیری
۷ = ۰	۷ = ۰	سطح اندازه‌گیری، Z
—	۲	ضخامت (کیلومتر)، (دایک)
٪۵	٪۵	میزان نورفه اضافه شده

جدول ۳. نتایج به دست آمده برای داده‌های آلووده به نورفه.

استوانه افقی	دایک نازک	کمیت‌های محاسبه شده
۱۰۰	۱۰۰	مکان بیشینه مقدار $ AAS_0 $ (نقطه X_0)
۱/۸۲	۲۹/۱۵	مقدار $ AAS_0 _{x_0}$
۰/۳۷	۴/۸۵	مقدار $ AAS_1 _{x_0}$
۰/۱	۱/۲	مقدار $ AAS_2 _{x_0}$
۵	۴	سطح ادامه فراسو (Up ward continuation level) (کیلومتر)
۹/۴۱	۸/۳۲	عمق (Z_0) (کیلومتر)
۱/۹۵	۱/۰۵	اندیس ساختاری (n)
۱۰۱/۰۶	۹۹/۰۳	مکان به دست آمده از روش اویلر
٪۴	٪۲/۵	درصد خطای پرآورده عمق

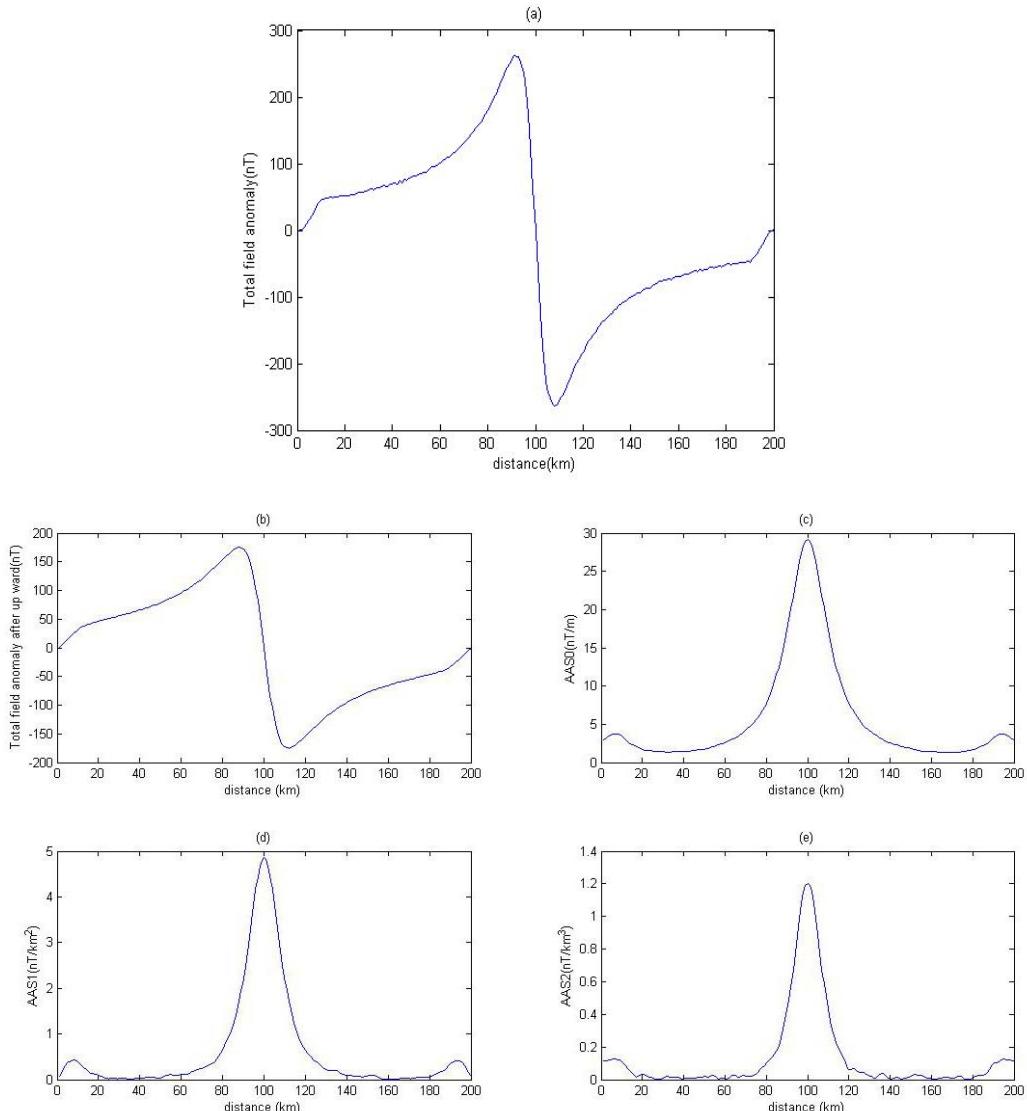
تحلیلی بی‌亨جاری مغناطیسی ناشی از این مدل‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل‌ها مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی دقیقاً روی ساختار قرار گرفته است و بر این اساس می‌توان محل چشمۀ را مشخص کرد. در شکل‌های ۲ و ۴ تغییرات عمق و اندیس ساختاری در مجاورت محل چشمۀ نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که تغییرات در

شکل‌های ۱-a و ۳-a نمودار بی‌亨جاری مغناطیسی ناشی از دایک و استوانه را نشان می‌دهد. شکل‌های ۱-b و ۳-b بی‌亨جاری مغناطیسی ناشی از دایک و استوانه را پس از ادامه فراسو نشان می‌دهند. با توجه به این شکل‌ها ملاحظه می‌شود که شدت بی‌亨جاری و دامنه نورفه‌ها تضعیف شده است. شکل‌های ۱-c و ۳-c دامنه سیگنال

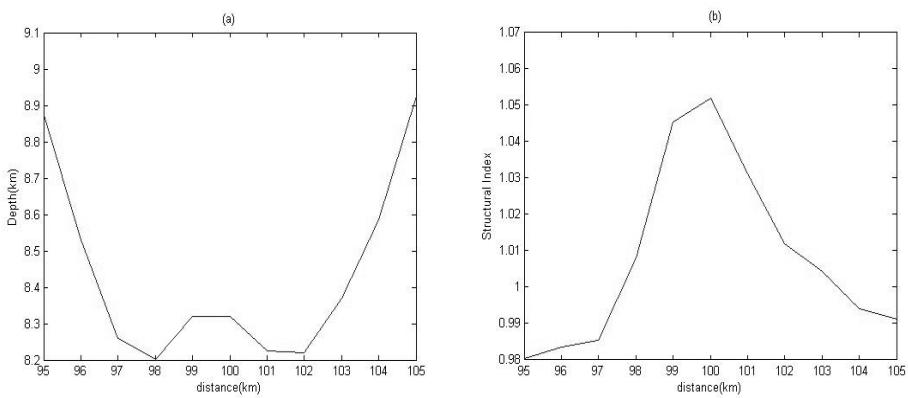
همچنین در مورد دایک ضخیم ممکن است که حالت گذار اتفاق بیفتند، یعنی دامنه سیگنال تحلیلی دارای یک بیشینه و دامنه سیگنال‌های تحلیلی مرتبه اول و دوم دارای دو بیشینه روی دایک باشند. برای رفع این مشکلات باید از ادامه فراسوی داده‌ها استفاده شود تا دامنه سیگنال‌های تحلیلی هر کدام دارای یک بیشینه شود. بنابراین دایک ضخیم نسبت به این سطح جدید، دایکی نازک خواهد بود و اندیس ساختاری آن نزد ۱ است. (سالم و همکاران، ۲۰۰۲)

مجاورت چشمی ناچیز است، به این معنی که خطأ در تعیین موقعیت چشمی براساس محل مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی خطای زیادی در محاسبات نهایی ایجاد نمی‌کند.

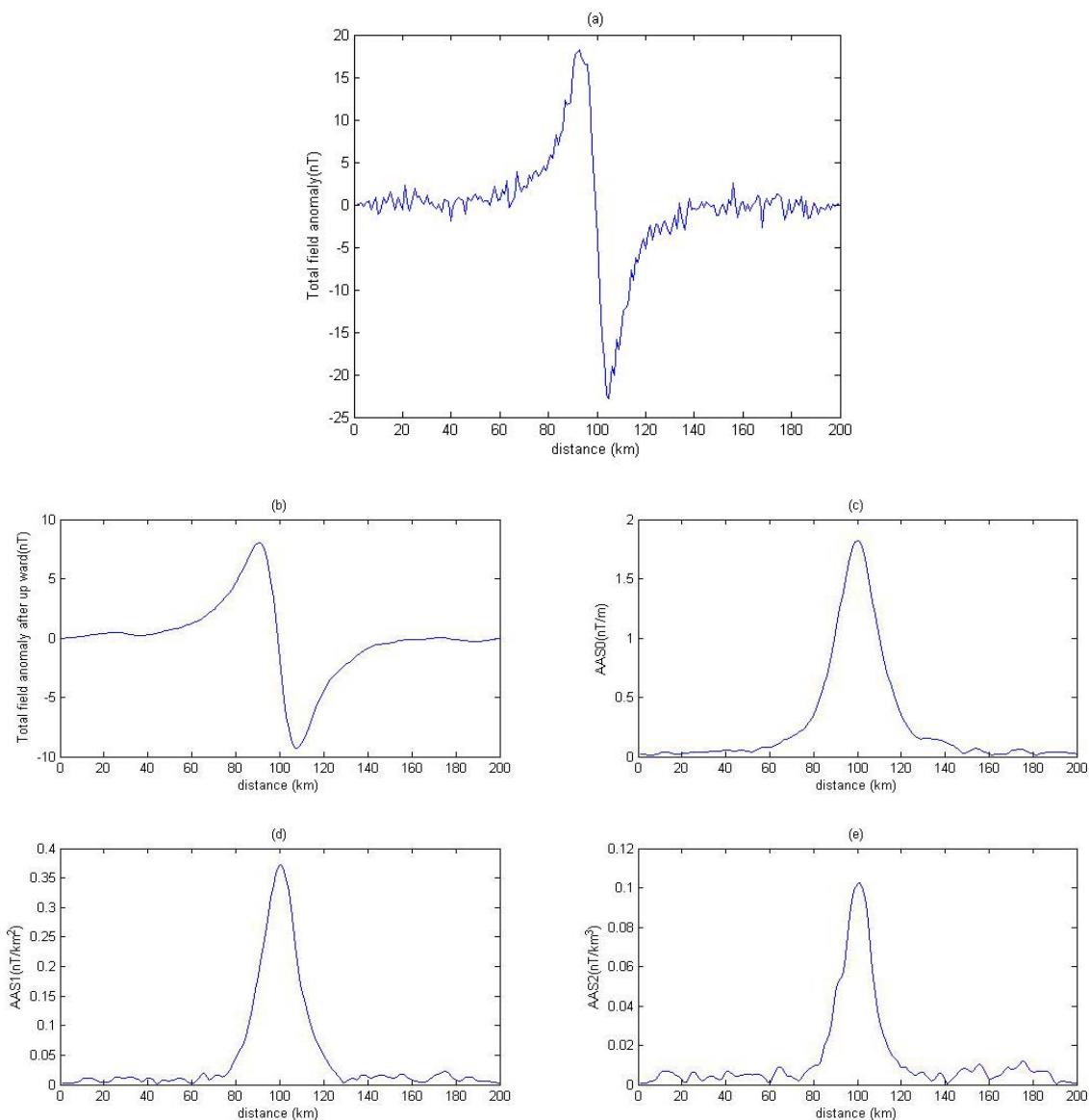
دایک ضخیم: دایکی است که ضخامت آن در مقایسه با عمق سطح رویه آن (یا عمق تا سطح اندازه‌گیری) بسیار بزرگ باشد. ضخیم یا نازک بودن دایک نسبت به سطح اندازه‌گیری سنجیده می‌شود. اگر نیم‌پهنه‌ای دایک در مقایسه با عمق تا سطح اندازه‌گیری بزرگ‌تر باشد، دامنه سیگنال تحلیلی روی دایک دارای دو بیشینه خواهد بود.



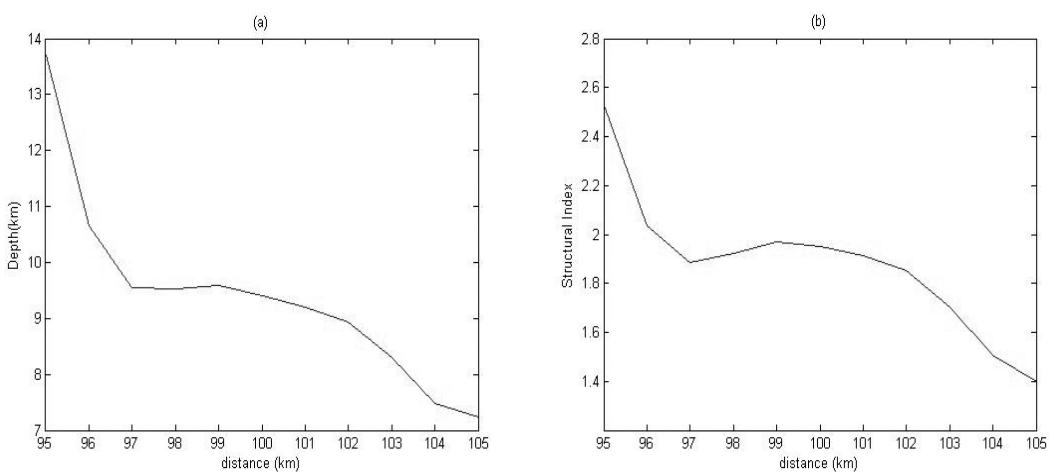
شکل ۱. (a) بی‌هنجاری مغناطیسی کل ناشی از داده‌های آلوده به نوشه دایک. (b) بی‌هنجاری مغناطیسی کل پس از ادامه فراسو (c) دامنه سیگنال تحلیلی. (d) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه اول. (e) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه دوم.



شکل ۲. (a) تغییرات عمق در مجاورت دایک. (b) تغییرات اندیس ساختاری در مجاورت دایک.



شکل ۳. (a) هنجاری مغناطیسی کل ناشی از داده های آنوده به نویه استوانه. (b) هنجاری مغناطیسی کل پس از ادامه فراسو. (c) دامنه سیگنال تحلیلی. (d) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه اول. (e) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه دوم.



شکل ۴. (a) تغییرات عمق در مجاورت استوانه، (b) تغییرات اندايس ساختاري در مجاورت استوانه.

است. به این ترتیب که عمق چشم نسبت به این سطح جدید ۱۸ متر خواهد بود. در حالی که مقدار به دست آمده $\frac{19}{8}$ متر است. بنابراین عمق دایک با خطای 10° درصد محاسبه شده است. همچنین مقدار محاسبه شده برای اندايس ساختاری $\frac{1}{1}$ است که در مقایسه با مقدار واقعی آن، یعنی عدد 1 ، 1 دقت قابل قبولی دارد. دقت این روش در محاسبه پارامترهای دایک ضخیم در مقایسه با دایک نازک کمتر است.

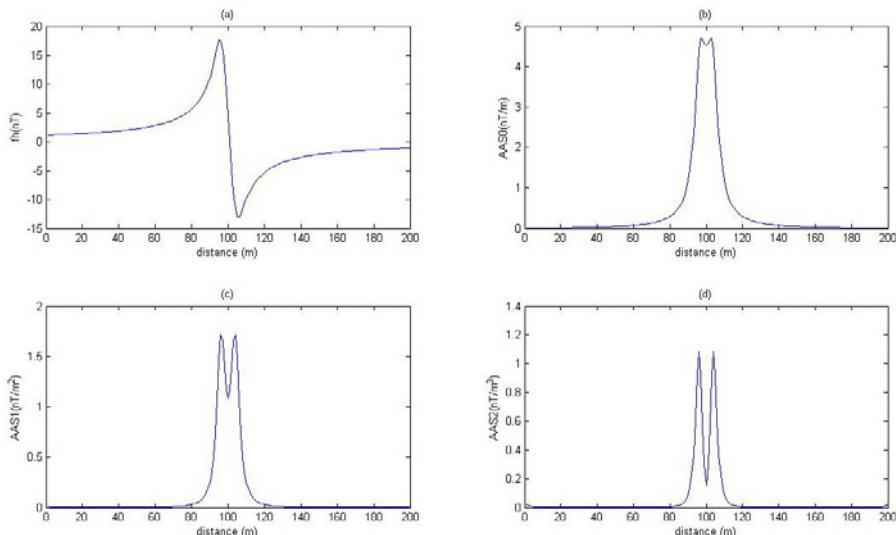
جدول ۴. مشخصات دایک ضخیم برای تولید داده مصنوعی.

پارامترهای دایک ضخیم	مقادیر پارامترها
عمق تا سطح اندازه گیری(متر)	۳
ضخامت(متر)	۸
زاویه میل میدان زمین	۴۰
زاویه میل مغناطیس شوندگی	۴۰
مغناطیس شوندگی(آمپر بر متر)	۱۰۰
سمت (آزمودت)	۴۵ درجه
زاویه شبیه دایک	۹۰ درجه
فاصله مرکز دایک از مبدأ اندازه گیری (متر)	۱۰۰
تعداد نقاط اندازه گیری	۲۰۰
فاصله بین نقاط اندازه گیری (متر)	۱

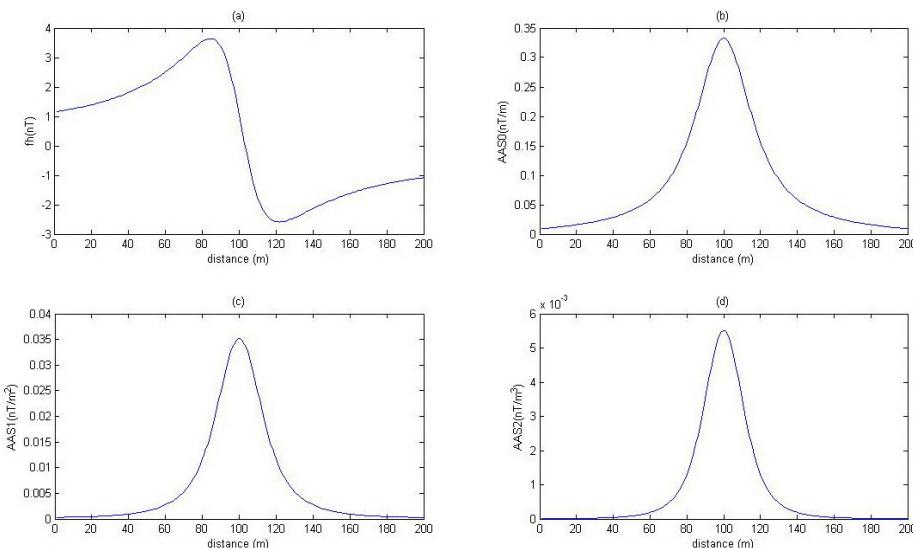
جدول ۴ مشخصات دایک ضخیم مورد استفاده را برای تولید داده مصنوعی نشان می دهد. شکل ۵ بی هنجاری مغناطیسی و دامنه سیگنال های تحلیلی را برای این دایک نشان می دهد. دامنه همه سیگنال های تحلیلی دارای دو بیشینه است. بنابراین لازم است که از ادامه فراسوی داده ها به سطح بالاتر استفاده شود. شکل ۶ بی هنجاری مغناطیسی و دامنه سیگنال های تحلیلی را پس از اعمال فیلتر ادامه فراسو نشان می دهد. با توجه به این شکل دامنه سیگنال های تحلیلی مراتب متفاوت دارای یک بیشینه هستند و می توان روشن AN_EUL را روی این داده ها اعمال کرد. پس از ادامه فراسوی داده ها و اعمال روش AN_EUL نتایج موردنظر طبق جدول ۵ به دست می آید. با توجه به نتایج این جدول، مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی در نقطه 100 متری از ابتدای نیم رخ، یعنی دقیقاً روی مرکز دایک قرار گرفته است. با محاسبه روابط 24 و 25 در این نقطه مقادیر $\frac{1}{1}$ و $\frac{4}{8}$ برای اندايس ساختاری و عمق به دست می آید. توجه به این نکته لازم است که درصد خطأ عمق (ذکر شده در جدول ۵) برای حالتی که داده ها به ارتفاع 15 متری از سطح اندازه گیری منتقل شده اند، محاسبه شده

جدول ۵. نتایج بدست آمده برای دایک ضخیم با استفاده از روش AN_EUL

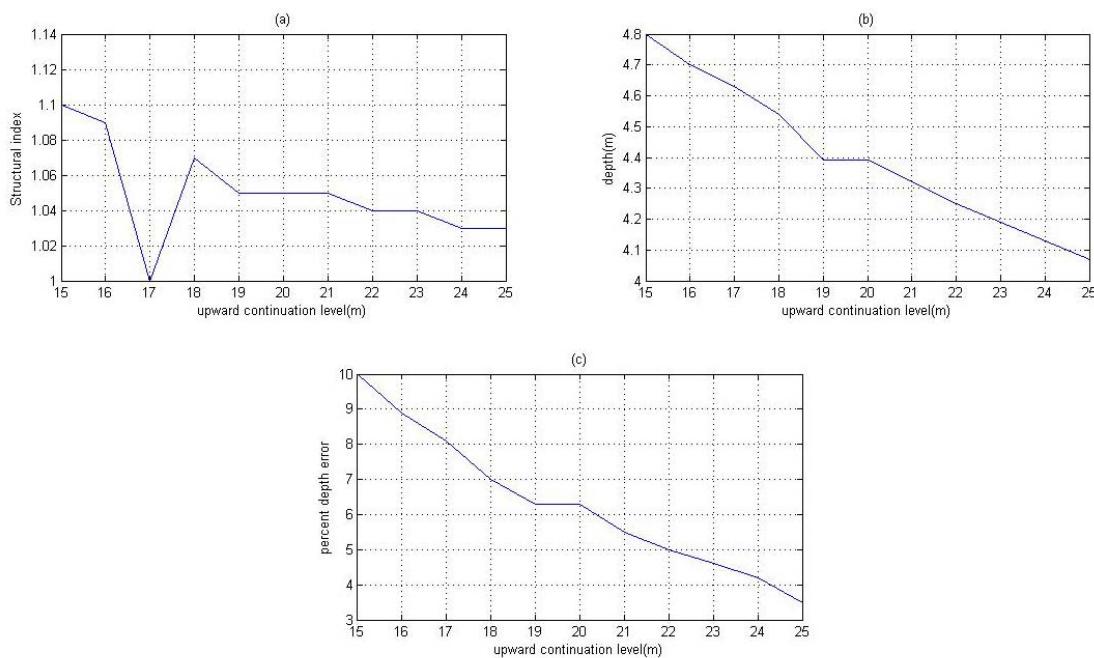
کمیت‌های محاسبه شده	مقادیر بدست آمده برای دایک
مکان مقدار بیشینه $ AAS_0 _{x_0}$ (نقطه x_0)	۱۰۰
مقدار $ AAS_0 _{x_0}$	۰/۳۳
مقدار $ AAS_1 _{x_0}$	۰/۰۳۵
مقدار $ AAS_2 _{x_0}$	۰/۰۰۵
سطح ادامه فراسو	۱۵
عمق (z_0)	۴/۸
اندیس ساختاری (n)	۱/۱
درصد خطای برآورد عمق	۱۰



شکل ۵. (a) بی‌هنجری مغناطیسی کل ناشی از دایک ضخیم. (b) دامنه سیگنال تحلیلی. (c) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه اول. (d) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه دوم.



شکل ۶. (a) بی‌هنجری مغناطیسی کل ناشی از دایک ضخیم پس از ادامه فراسو به ارتفاع ۱۵ امتی. (b) دامنه سیگنال تحلیلی. (c) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه اول. (d) دامنه سیگنال تحلیلی مرتبه دوم.



شکل ۷. (a) تغییرات اندیس ساختاری با افزایش سطح ادامه فراسو. (b) در صد خطای برآورد عمق با افزایش سطح ادامه فراسو. (c) در ارتفاع سطح ادامه فراسو.

بستگی به کیفیت داده‌های اندازه‌گیری شده دارد و به منظور کاهش اثر بینهای سطحی و نویفه‌ها از فیلتر ادامه فراسو استفاده می‌شود. مهم‌ترین مزیت این روش نسبت به روش واهمامیخت این است که در این روش نیازی به انتخاب اندیس ساختاری قبل از اعمال روش نیست و این کمیت مستقیماً محاسبه می‌شود. در این مقاله این روش روی داده‌های مصنوعی تولید شده از مدل‌های مصنوعی دایک نازک، دایک ضخیم و استوانه افقی اعمال شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که این روش در برآورد مکان و محاسبه عمق و اندیس ساختاری چشمه‌های مغناطیسی دارای دقت خوب و درصد قابل قبولی از خطای محاسباتی است. با استفاده از AN-EUL برای مدل مصنوعی دایک نازک برای عمق و اندیس ساختاری، به ترتیب مقادیر $8/32$ و $1/05$ بدست آمد که در مقایسه با مقادیر واقعی شان (8 و 1) می‌توان گفت که دقت روش، با وجود اینکه این داده‌ها آلوهه به نویفه بودند،

شکل ۷ تغییرات اندیس ساختاری، عمق و درصد خطای برآورد عمق را با افزایش ارتفاع سطح ادامه فراسو نشان می‌دهد. ارتفاع مطلوب برای ادامه فراسو اولین ارتفاعی است که دامنه سیگنال‌های تحلیلی تکین می‌شود. در شکل‌های a و b پس از ارتفاع 15 متری، با افزایش ارتفاع میزان تغییرات اندیس ساختاری و عمق جزئی است.

۴ نتیجه‌گیری

در این مقاله روش جدید خودکار (AN_EUL) برای تفسیر داده‌های مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت که اساس آن جایگذاری مشتق‌های معادله همگن اویلر در معادله سیگنال تحلیلی است. در این روش مکان افقی چشم‌های با استفاده از محل مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی برآورد می‌شود و عمق و شکل هندسی چشم‌های به طور همزمان در مکان چشم‌های محاسبه می‌شود. دقت این روش به دلیل استفاده از مشتق‌های مرتبه بالا، تا حدی زیادی

- Ravat, D., 1996a, Analysis of the Euler method and its applicability in environmental magnetic investigation, *J. Environmental. Eng. Geophys.*, **1**, 229–238.
- Reid, A. B., Allsop, J. M., Granser, H., Millet, A. J. and Somerton, I. W., 1990, Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution, *Geophysics*, **55**, 80–91.
- Salem, A., Ravat, D., Gamey, T. J. and Ushijima, K., 2002, Analytic Signal approach and its applicability in environmental magnetic investigations, *J. Appl. Geophys.*, **49**, 231–244.
- Salem, A. and Ravat, D. 2003, A combined analytic signal and Euler method (AN-EUL) for automatic interpretation of magnetic data. *Geophysics*, **68**, 1952–1961.
- Thompson, D. T., 1982, EULDEPTH: A new technique for making Computer-assisted depth estimates from magnetic data, *Geophysics*, **47**, 31–37.

خوب و قابل قبول است. همچنین در مورد مدل استوانه افقی که داده‌های مصنوعی تولید شده از آن نیز به نوفه آلوده شده بودند ملاحظه شد که مقادیر ۹/۴۱ و ۱/۹۵ برای عمق و انداز ساختاری به دست آمد که مقایسه آنها با مقادیر واقعی شان (۱۰ و ۲)، بیانگر دقیق و قابلیت خوب روش در برآوردن پارامترهای استوانه است. درنهایت برای مدل مصنوعی دایکی ضخیم، پس از ادامه فراسوی داده‌ها به یک سطح مناسب، انداز ساختاری و عمق با خطای ۱۰ درصد محاسبه می‌شود که این میزان خطای قابل قبول است.

منابع

- Atchuta Rao, D., Ram Babu, H. V. and Sanker Narayan, P. V., 1981, Interpretation of magnetic anomalies due to dikes: The complex Gradient method, *Geophysics*, **46**, 1572–1578.
- Blakely, R. J., 1995, Potential theory in gravity and magnetic applications, Cambridge Univ. Press.
- Bastani, M. and Pedersen, L. B., 2001, Automatic interpretation of magnetic dikes parameters using the analytic signal technique, *Geophysics*, **66**, 551–561.
- Hsu, S. K., Sibuet, J. C. and Shyu, C. T., 1996, High-resolution detection of geologic boundaries from potential anomalies: An enhanced analytic signal technique, *Geophysics*, **61**, 373–386.
- Hsu, S. K., Coppens, D. and Shyu, C. T., 1998, Depth to magnetic source using the generalized analytic signal, *Geophysics*, **63**, 1947–1957.
- Nabighian, M. N., 1972, The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: Its properties and use for automated anomaly interpretation, *Geophysics*, **37**, 507–517.
- Nabighian, M. N., 1974, Additional comments on the analytic signal of twodimensional magnetic bodies with polygonal cross-section, *Geophysics*, **39**, 85–92.
- Nabighian, M. N., 1984, toward a three-dimensional automatic interpretation of potential-field data via generalized Hilbert transforms: Fundamental relations, *Geophysics*, **49**, 780–786.